

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2010

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2010

N:o 145—146

SISÄLLYS

N:o		Sivu
145	Tasavallan presidentin asetus Suomen liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta	701
146	Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta	703

N:o 145

Tasavallan presidentin asetus

Suomen liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen liittyminen kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2010.

Eduskunta on hyväksynyt liittymisilmoituksen 14 päivänä joulukuuta 2009 ja tasavallan presidentti 29 päivänä joulukuuta 2009. Suomen liittymisilmoitus on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 5 päivänä helmikuuta 2010.

2 §

Kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta annettu laki (1659/2009) tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2010.

3 §

Suomi on antanut seuraavat liittymisilmoitusta koskevat ilmoitukset:

Liittymisilmoituksen 4 kappaleessa tarkoitettu viranomaisen, joka vastaa liittymisilmoituksen mukaisten tavoitteiden ja velvoitteiden täyttämisestä ja joka edustaa Suomea ohjelmakokouksissa, on rajavartiolaitos.

Liittymisilmoituksen 3 kappaleessa tarkoitettu yhteydenottopiste hätäilmoituksia varten on Turun meripelastuskeskus.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 27/2010)

4 §

Liittymisilmoituksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2010.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri *Anne Holmlund*

N:o 146

Valtioneuvoston asetus

työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 39 §:n nojalla:

1 §

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on työntekijän suojeleminen työssä esiintyviltä vaaroilta ja haitoilta, jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua altistumisesta keinotekoiselle eli muulle kuin luonnon optiselle säteilylle.

2 §

Soveltoamisala

Tätä asetusta sovelletaan työhön, johon sovelletaan työturvallisuuslakia (738/2002) ja jossa optisesta säteilystä aiheutuu tai saattaa aiheutua vaaraa työntekijän silmien tai ihon terveydelle.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) *optisella säteilyllä* keinotekoisista sähkömagneettista säteilyä aallonpituusalueella 100 nanometriä (nm) - 1 millimetriä (mm);
- 2) *ultraviolettisäteilyllä* optista säteilyä aallonpituusalueella 100 - 400 nm;
- 3) *näkyvällä säteilyllä eli valolla* optista säteilyä aallonpituusalueella 380 - 780 nm;

4) *infrapunasäteilyllä* optista säteilyä aallonpituusalueella 780 nm - 1 mm;

5) *laserilla* laitetta, joka voidaan saada tuottamaan tai vahvistamaan sähkömagneettista säteilyä optisen säteilyn aallonpituusalueella pääasiassa hallitun emissioprosessin avulla;

6) *lasersäteilyllä* laserista tulevaa optista säteilyä;

7) *epäkoherentilla säteilyllä* optista säteilyä, joka on muuta kuin lasersäteilyä;

8) *altistumisen raja-arvoilla* optiselle säteilylle altistumisen rajoja, jotka perustuvat suoraan todettuihin terveysvaikutuksiin ja biologisiin näkökohtiin;

9) *irradianssilla (E)* tietylle pinnalle kohdistuvaa säteilytehoa pinta-alayksikköä kohti ilmaistuna watteina neliometriä kohti (W m^{-2});

10) *energiatiheydellä (H)* tehotiheyden aikaintegraalia ilmaistuna jouleina neliometriä kohti (J m^{-2});

11) *radianssilla (L)* säteilytehoa avaruuskulmayksikköä ja pinta-alayksikköä kohti ilmaistuna watteina neliometriä ja steradiania kohti ($\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$).

4 §

Altistumisen raja-arvot

Epäkoherentille säteilylle altistumisen raja-arvot vahvistetaan liitteessä I.

Lasersäteilylle altistumisen raja-arvot vahvistetaan liitteessä II.

Näiden rajojen noudattamisella varmistetaan optiselle säteilylle altistuvien työntekijöiden suojeleminen kaikilta tunnetuilta haitallisilta terveysvaikutuksilta.

5 §

Optisen säteilyn selvittäminen

Työnantajan on tunnistettava optista säteilyä aiheuttavat lähteet ja sen mukaisesti selvittävä, altistuvatko työntekijät optiselle säteilylle.

6 §

Altistumistason arviointi, mittaus ja laskenta

Työnantajan on arvioitava työntekijän optiselle säteilylle altistumisen taso. Tarvittaessa työnantajan on joko mitattava tai laskettava tämä.

7 §

Arviointi-, mittaus- ja laskentamenetelmät

Altistumisen arviointi, mittaus ja laskenta on suunniteltava ja toteutettava asianmukaisesti sekä suoritettava sopivin väliajoin. Arvioijan, mittaajan ja laskijan tulee olla työterveyshuollon tai työhygienian asiantuntija tai muu työnantajan palveluksessa oleva tai ulkopuolinen henkilö, jolla on tarvittava kyky ja taito arvioida, mitata ja laskea optista säteilyä.

Optiselle säteilylle altistumisen arvioinnissa, mittauksessa ja laskennassa on noudatettava lasersäteilyä koskevia Kansainvälisen sähkötekniikan komitean (IEC) standardeja sekä epäkoherenttia säteilyä koskevia Kansainvälisen valaistuskomitean (CIE) ja Euroopan standardointikomitean (CEN) suosituksia. Sellaisissa altistumistilanteissa, joita nämä standardit ja suositukset eivät kata, ja siihen asti, kunnes tarkoituksenmukaiset EU:n standardit tai suositukset ovat saatavissa, säteilylle altistuminen on arvioitava, mitattava ja laskettava käytettävissä olevien kansallisten tai kansainvälisten tieteellisesti perusteltujen ohjeiden mukaisesti. Altistumi-

sen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös optista säteilyä aiheuttavan laitteen valmistajan ilmoittamat tiedot, jos laite kuuluu asiaa koskevien yhteisön direktiivien soveltamisalaan.

8 §

Altistumistietojen säilyttäminen

Työnantajan on säilytettävä tiedot arvioiduista, mitatuista ja lasketuista altistumistasoista niin kauan kuin se on arvioinnin, mitauksen tai laskennan osalta kohteen optiselle säteilylle altistumisen arvioinnin ja ehkäisemisen kannalta tarpeen.

9 §

Vaaran arviointi

Työnantajan on 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun selvityksen ja määrittelyn perusteella arvioitava vaaran merkitys työntekijöiden terveydelle. Työnantajalla tulee olla hallussaan tämän riskin arvioinnin tulos, jonka hän voi sisällyttää työpaikkaselvitykseen tai muuhun selvitykseen. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus saada tieto arvioinnin tuloksesta.

Riskin arviointiin voi sisältyä selvitys siitä, että yksityiskohtaisempi riskien arviointi ei ole tarpeellinen riskin luonteen ja laajuuden vuoksi. Riskin arviointi on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava erityisesti, kun työmenetelmissä tai työolosuhteissa on tapahtunut sen kannalta merkittäviä muutoksia tai kun työntekijän terveydentilan seuranta osoittaa sen tarpeelliseksi.

10 §

Riskin arvioinnissa huomioon otettavat seikat

Työnantajan on riskin arvioinnissa otettava erityisesti huomioon:

- 1) optiselle säteilylle altistumisen taso sekä optisen säteilyn aallonpituus ja kesto;
- 2) optiselle säteilylle altistumisen raja-arvot;
- 3) optisen säteilyn vaikutukset niiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, joiden työterveyshuolto on todennut olevan erityisen alttiita vaaralle;

4) optisen säteilyn ja valolle herkistävien kemiallisten aineiden välisestä vuorovaikutuksesta työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuva vaara;

5) optisen säteilyn epäsuorat vaikutukset, kuten tilapäinen sokaistuminen, räjähdys tai tulipalo;

6) sellaisten korvaavien laitteiden olemassaolo, jotka on suunniteltu vähentämään optiselle säteilylle altistumista;

7) terveydentilan seurannassa saadut tiedot, mukaan lukien julkaistut tiedot, silloin kun se on mahdollista;

8) altistuminen useille optisen säteilyn lähteille;

9) IEC-standardissa määritelty laseriin sovellettava luokitus ja muiden sellaisten keino-tekoisten lähteiden vastaavat luokitukset, jotka todennäköisesti aiheuttavat samanlaisen vaurion kuin luokan 3 B tai 4 laser;

10) tiedot, jotka optisen säteilyn lähteiden ja niihin liittyvien työvälineiden ja suojainten valmistajat ovat antaneet asiaa koskevien yhteisön direktiivien mukaisesti.

11 §

Altistumisen ehkäiseminen tai vähentäminen

Työnantajan on poistettava optiselle säteilylle altistumisesta työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat vaarat tai, jollei tämä ole mahdollista, vähennettävä ne mahdollisimman alhaiselle tasolle, ottaen huomioon tekninen kehitys ja vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi käytettävissä olevat toimenpiteet.

12 §

Toimenpiteet raja-arvojen ylittymisen uhatessa

Jos riskin arvioinnin tulokset osoittavat, että työntekijät saattavat altistua raja-arvot ylittävälle optiselle säteilylle, työnantajan on laadittava ja toteutettava ohjelma raja-arvot ylittävän altistumisen ehkäisemiseksi (*torjuntaohjelma*).

Työpaikoilla, joissa työntekijät saattavat altistua raja-arvot ylittävälle optiselle säteilylle, työnantajan on ilmoitettava optisesta

säteilystä asianmukaisin merkein, ja kyseiset alueet on merkittävä ja pääsyä niille rajoitettava, jos se on teknisesti mahdollista.

13 §

Torjuntaohjelma

Torjuntaohjelmaan otetaan teknisiä tai toiminnan järjestelyä koskevia toimenpiteitä raja-arvot ylittävän altistumisen estämiseksi. Siinä on asianmukaisella tavalla kiinnitettävä huomiota erityisesti:

1) vaihtoehtoihin työmenetelmiin;

2) vähemmän optista säteilyä lähettävien laitteiden valintaan tehtävä työ huomioon ottaen;

3) sellaisiin säteilylähteeseen tehtäviin teknisiin toimenpiteisiin, joilla työntekijöiden altistumista säteilylle voidaan vähentää;

4) asianmukaisiin työvälineiden, työpaikkojen ja työpisteissä käytettävien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmiin;

5) työpaikkojen ja työpisteiden suunnitteluun;

6) altistumisen keston ja tason rajoittamiseen;

7) asianmukaisten henkilönsuojainten saatavuuteen;

8) laitteen valmistajan ohjeisiin.

14 §

Toimenpiteet raja-arvon ylittyessä

Jos työntekijän altistuminen optiselle säteilylle ylittää 4 §:ssä säädetyn raja-arvon, työnantajan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.

Työnantajan on selvitettävä raja-arvon ylittymisen syyt ja muutettava suojausta ja ennaltaehkäisyä niin, että ylitys ei toistu.

15 §

Riskeille erityisen alttiit työntekijät

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin työterveyshuollon osoittamien optisen säteilyn aiheuttamalle riskille erityisen alttiiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

16 §

Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työssään optiselle säteilylle altistuville työntekijöille tarpeelliset tiedot 8 §:ssä tarkoitetun riskin arvioinnin tuloksista sekä opetusta ja ohjausta erityisesti:

- 1) toimenpiteistä optisesta säteilystä aiheutuvien vaarojen ja haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi mahdollisimman vähäisiksi;
- 2) altistumisen raja-arvoista sekä mahdollisista riskeistä;
- 3) altistumisen arviointi-, mittaus- ja las-

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

kentatuloksista sekä niiden merkityksestä turvallisuuden ja terveyden kannalta;

4) optisesta säteilystä aiheutuvien haitallisten terveysvaikutusten tunnistamisesta ja ilmoittamisesta;

5) työterveyshuollosta ja sen toiminnasta;

6) turvallisista työtavoista, sekä

7) asianmukaisten henkilönsuojainten oikeasta käytöstä.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysministeri *Liisa Hyssälä*

Hallitussihteeri Tuula Andersin

LIITE I

Epäkoherentti optinen säteily

Biofysikaalisesti merkittävät optisen säteilyn altistumisarvot voidaan määrittää alla esitettyjen kaavojen avulla. Tietyn kaavan käyttö riippuu kulloisestakin lähteestä tulevan säteilyn alueesta, ja tuloksia olisi verrattava vastaaviin altistumisen raja-arvoihin, jotka on esitetty taulukossa 1.1. Joihinkin optisen säteilyn lähteisiin voidaan soveltaa useampaa kuin yhtä altistumisarvoa ja sitä vastaavaa altistumisrajaa.

Jäljempänä olevat a–o alakohdat viittaavat vastaaviin riveihin taulukossa 1.1.

$$a) \quad H_{\text{eff}} = \int_0^t \int_{\lambda=180 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda \cdot dt \quad (H_{\text{eff}} \text{ on merkityksellinen vain välillä 180–400 nm})$$

$$b) \quad H_{\text{UVA}} = \int_0^t \int_{\lambda=315 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt \quad (H_{\text{UVA}} \text{ on merkityksellinen vain välillä 315–400 nm})$$

$$c, d) \quad L_B = \int_{\lambda=300 \text{ nm}}^{\lambda=700 \text{ nm}} L_{\lambda}(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda \quad (L_B \text{ on merkityksellinen vain välillä 300–700 nm})$$

$$e, f) \quad E_B = \int_{\lambda=300 \text{ nm}}^{\lambda=700 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda \quad (E_B \text{ on merkityksellinen vain välillä 300–700 nm})$$

$$g-l) \quad L_R = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_{\lambda}(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot d\lambda \quad (\lambda_1 \text{ ja } \lambda_2 : \text{ks. asianmukaiset arvot taulukosta 1.1})$$

$$m, n) \quad E_{\text{IR}} = \int_{\lambda=780 \text{ nm}}^{\lambda=3000 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda) \cdot d\lambda \quad (E_{\text{IR}} \text{ on merkityksellinen vain välillä 780–3 000 nm})$$

$$o) \quad H_{\text{iho}} = \int_0^t \int_{\lambda=380 \text{ nm}}^{\lambda=3000 \text{ nm}} E_{\lambda}(\lambda, t) \cdot d\lambda \cdot dt \quad (H_{\text{iho}} \text{ on merkityksellinen vain välillä 380–3 000 nm})$$

Tässä asetuksessa yllä esitetyt kaavat voidaan korvata seuraavilla lausekkeilla ja käyttämällä taulukoissa esitettyjä erillisiä arvoja:

$$a) \quad E_{\text{eff}} = \sum_{\lambda=180 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} E_{\lambda} \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda \quad \text{ja } H_{\text{eff}} = E_{\text{eff}} \cdot \Delta t$$

$$b) \quad E_{\text{UVA}} = \sum_{\lambda=315 \text{ nm}}^{\lambda=400 \text{ nm}} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda \quad \text{ja } H_{\text{UVA}} = E_{\text{UVA}} \cdot \Delta t$$

$$c, d) \quad L_B = \sum_{\lambda=300 \text{ nm}}^{\lambda=700 \text{ nm}} L_{\lambda} \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

$$e, f) \quad E_B = \sum_{\lambda=300 \text{ nm}}^{\lambda=700 \text{ nm}} E_{\lambda} \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

$$g-l) \quad L_R = \sum_{\lambda_1}^{\lambda_2} L_{\lambda} \cdot R(\lambda) \cdot \Delta\lambda \quad (\lambda_1 \text{ ja } \lambda_2 : \text{ks. asianmukaiset arvot taulukosta 1.1})$$

$$m, n) \quad E_{\text{IR}} = \sum_{\lambda=780 \text{ nm}}^{\lambda=3000 \text{ nm}} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda$$

$$o) \quad E_{\text{iho}} = \sum_{\lambda=380 \text{ nm}}^{\lambda=3\,000 \text{ nm}} E_{\lambda} \cdot \Delta\lambda \quad \text{ja } H_{\text{iho}} = E_{\text{iho}} \cdot \Delta t$$

Selitykset:

- E_{λ} (λ , t), E_{λ} *spektrinen irradianssi tai spektrinen tehoteho*: tietylle pinnalle kohdistuva säteilyteho pinta-alayksikköä kohti, joka ilmaistaan watteina neliometriä ja nanometriä kohti [$\text{W m}^{-2} \text{ nm}^{-1}$]; E_{λ} (λ , t):n ja E_{λ} :n arvot tulevat mittauksista tai laitteiston valmistaja voi toimittaa ne;
- E_{eff} *efektiivinen irradianssi (UV-alue)*: $S(\lambda)$:lla spektrisesti painotettu laskettu irradianssi UV-aallonpituusalueella 180–400 nm, joka ilmaistaan watteina neliometriä kohti [W m^{-2}];
- H *energiatiheys*: irradianssin aikaintegraali, ilmaistaan jouleina neliometriä kohti [J m^{-2}];
- H_{eff} *efektiivinen energiatiheys*: $S(\lambda)$:lla spektrisesti painotettu säteilyaltistuminen, joka ilmaistaan jouleina neliometriä kohti [J m^{-2}];
- E_{UVA} *kokonaisirradianssi (UVA)*: laskettu irradianssi UVA-aallonpituusalueella 315 — 400 nm, joka ilmaistaan watteina neliometriä kohti [W m^{-2}];
- H_{UVA} *energiatiheys (UVA)*: irradianssin integraali ajan ja aallonpituuden suhteen UVA-aallonpituusalueella 315–400 nm, joka ilmaistaan jouleina neliometriä kohti [J m^{-2}];
- $S(\lambda)$ *spektrinen painotus*, jossa otetaan huomioon UV-säteilyn silmiin ja ihoon kohdistuvien terveysvaikutusten aallonpituusriippuvuus, (taulukko 1.2) [dimensioton];
- t , Δt *aika, altistumisen kesto*, joka ilmaistaan sekunteina [s];
- λ *aallonpituus*, joka ilmaistaan nanometreinä [nm];
- $\Delta \lambda$ *kaistanleveys*, joka ilmaistaan nanometreinä [nm], laskelma- tai mittaussväli;
- L_{λ} (λ), L_{λ} *lähteen spektrinen radianssi*, joka ilmaistaan watteina neliometriä, steradiania ja nanometriä kohti [$\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1} \text{ nm}^{-1}$];
- $R(\lambda)$ *spektrinen painotus*, jossa otetaan huomioon näkyvän ja IRA-säteilyn silmälle aiheuttaman lämpövaurion aallonpituusriippuvuus (taulukko 1.3) [dimensioton];
- L_R *efektiivinen radianssi (lämpövaurio)*: $R(\lambda)$:lla spektrisesti painotettu laskettu radianssi, joka ilmaistaan watteina neliometriä ja steradiania kohti [$\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$];
- $B(\lambda)$ *spektrinen painotus*, jossa otetaan huomioon sinisen valon silmälle aiheuttaman fotokemiallisen vaurion aallonpituusriippuvuus (taulukko 1.3) [dimensioton];
- L_B *efektiivinen radianssi (sininen valo)*: $B(\lambda)$:lla spektrisesti painotettu laskettu radianssi, joka ilmaistaan watteina neliometriä ja steradiania kohti [$\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$];
- E_B *efektiivinen irradianssi (sininen valo)*: $B(\lambda)$:lla spektrisesti painotettu laskettu irradianssi, joka ilmaistaan watteina neliometriä kohti [W m^{-2}];
- E_{IR} *kokonaisirradianssi (lämpövaurio)*: laskettu infrapunasäteilyn irradianssi aallonpituusalueella 780 nm–3 000 nm, joka ilmaistaan watteina neliometriä kohti [W m^{-2}];
- E_{iho} *kokonaisirradianssi (näkyvä, IRA ja IRB)*: laskettu näkyvän ja infrapunasäteilyn irradianssi aallonpituusalueella 380 nm–3 000 nm, joka ilmaistaan watteina neliometriä kohti [W m^{-2}];
- H_{iho} *energiatiheys*: irradianssin aika- ja aallonpituusintegraali näkyvän ja infrapunasäteilyn aallonpituusalueella 380–3 000 nm, joka ilmaistaan jouleina neliometriä kohti [J m^{-2}];
- α *kulmakoko*: näkyvän lähteen tietyllä katseluetäisyydellä rajaama kulma, joka ilmaistaan milliradiaaneina (mrad). Näkyvä lähde on todellinen tai virtuaalinen kohde, joka muodostaa pienimmän mahdollisen kuvan verkkokalvolle.

Taulukko 1.1
Altistumisen raja-arvot epäkoherentille optiselle säteilylle

Kohta	Aallonpituus nm	Altistumisen raja-arvo	Yksiköt	Huomautus	Kehonosa	Vaurio
a.	180–400 (UVA, UVB ja UVC)	$H_{UV} = 30$ päivittäinen arvo (8 h)	$[J\ m^{-2}]$		silmä sarveiskalvo sidekalvo mykiö iho	sarveiskalvotulehdus sidekalvotulehdus harnaakaihi eryteema elastoosi ihosyöpä
b.	315–400 (UVA)	$H_{UVA} = 10^4$ päivittäinen arvo (8 h)	$[J\ m^{-2}]$		silmä mykiö	harnaakaihi
c.	300–700 (sininen valo) ks. huom. 1	$H_B = \frac{10^6}{t}$ $L_B = \frac{10^6}{t}$ kun $t \leq 10\ 000\ s$	$L_B\ [W\ m^{-2}\ sr^{-1}]$ t: [sekuntia]	kun $\alpha \geq 11\ mrad$		
d.	300–700 (sininen valo) ks. huom. 1	$L_B = 100$ kun $t > 10\ 000\ s$	$[W\ m^{-2}\ sr^{-1}]$			
e.	300–700 (sininen valo) ks. huom. 1	$E_B = \frac{100}{t}$ kun $t \leq 10\ 000\ s$	$E_B\ [W\ m^{-2}]$ t: [sekuntia]	kun $\alpha < 11\ mrad$ ks. huom. 2	silmä verkkokalvo	verkkokalvonrappautuma
f.	300–700 (sininen valo) ks. huom. 1	$E_B = 0,01$ t > 10 000 s	$[W\ m^{-2}]$			

Kohta	Aallonpituus nm	Alistumisen raja-arvo	Yksiköt	Huomautus	Kehonosa	Vaurio
g.	380–1 400 (näkyvä ja IRA)	$L_R = \frac{2,8 \times 10^7}{C_a}$ kun $t > 10$ s	[W m ⁻² sr ⁻¹]	$C_a = 1,7$, kun $\alpha \leq 1,7$ mrad $C_a = \alpha$, kun $1,7 \leq \alpha \leq 100$ mrad $C_a = 100$, kun $\alpha > 100$ mrad $\lambda_1 = 380$; $\lambda_2 = 1\,400$	silmiä verkkokalvo	verkkokalvon palovamma
h.	380–1 400 (näkyvä ja IRA)	$L_R = \frac{5 \times 10^7}{C_a t^{0,25}}$ kun $10 \mu s \leq t \leq 10$ s	L_{Rt} [W m ⁻² sr ⁻¹] t: [sekuntia]			
i.	380–1 400 (näkyvä ja IRA)	$L_R = \frac{8,89 \times 10^8}{C_a}$ kun $t < 10 \mu s$	[W m ⁻² sr ⁻¹]			
j.	780–1 400 (IRA)	$L_R = \frac{6 \times 10^6}{C_a}$ kun $t > 10$ s	[W m ⁻² sr ⁻¹]	$C_a = 11$, kun $\alpha \leq 11$ mrad $C_a = \alpha$, kun $11 \leq \alpha \leq 100$ mrad $C_a = 100$, kun $\alpha > 100$ mrad (mittausnäkökentät: 11 mrad) $\lambda_1 = 780$; $\lambda_2 = 1\,400$	silmiä verkkokalvo	verkkokalvon palovamma
k.	780–1 400 (IRA)	$L_R = \frac{5 \times 10^7}{C_a t^{0,25}}$ kun $10 \mu s \leq t \leq 10$ s	L_{Rt} [W m ⁻² sr ⁻¹] t: [sekuntia]			
l.	780–1 400 (IRA)	$L_R = \frac{8,89 \times 10^8}{C_a}$ kun $t < 10 \mu s$	[W m ⁻² sr ⁻¹]			
m.	780–3 000 (IRA ja IRE)	$E_{IR} = 18\,000 t^{0,75}$ kun $t \leq 1\,000$ s	E: [W m ⁻²] t: [sekuntia]		silmiä sarveiskalvo mykiö	sarveiskalvon palovamma harmaakaihi
n.	780–3 000 (IRA ja IRE)	$E_{IR} = 100$ kun $t > 1\,000$ s	[W m ⁻²]			

Kohtia	Aallonpituus nm	Altistumisen raja-arvo	Yksiköt	Huomautus	Kehonosa	Vaurio
o.	380–3 000 (näkyvä, IRA ja IRB)	$H_{lim} = 20\,000\ t^{0,25}$ kun $t < 10\text{ s}$	H: $J\text{ m}^{-2}$ t: [sekuntia]		iho	palovamma

Huom 1: Alue 300–700 nm kattaa osan UVB-säteilyä, UVA-säteilyn kokonaan ja suurimman osan näkyvästä säteilystä. Näihin liittyvään riskiin viitataan kuitenkin yleisesti ilmauksella ”sininen valo”. Tarkasti ottaen sininen valo kattaa ainoastaan suunnilleen 400–490 nm:n välisen alueen.

Huom 2: Paikallaan pysyvien erittäin pienien (kulmakoko on < 11 mrad) lähteiden osalta L_{10} voidaan korvata $E_{p,flä}$. Tätä sovelletaan tavallisiin vain oftalmologisiin laitteisiin tai liikkumattomaan silmään anestesian aikana. Suurin mahdollinen ”tuijotusika” saadaan seuraavasti: $t_{max} = 100/E_p$, jossa E_p on ilmaistu wattina neliömetriä kohti ($W\text{ m}^{-2}$). Tavallisten näkötehtävien aikana tämä ei silmälilikeistä johtuen yltä 100 s.

Taulukko 1.2

S (λ) [dimensioton], 180 nm–400 nm

λ (nm)	S (λ)	λ (nm)	S (λ)	λ (nm)	S (λ)	λ (nm)	S (λ)	λ (nm)	S (λ)
180	0,0120	228	0,1737	276	0,9434	324	0,000520	372	0,000086
181	0,0126	229	0,1819	277	0,9272	325	0,000500	373	0,000083
182	0,0132	230	0,1900	278	0,9112	326	0,000479	374	0,000080
183	0,0138	231	0,1995	279	0,8954	327	0,000459	375	0,000077
184	0,0144	232	0,2089	280	0,8800	328	0,000440	376	0,000074
185	0,0151	233	0,2188	281	0,8568	329	0,000425	377	0,000072
186	0,0158	234	0,2292	282	0,8342	330	0,000410	378	0,000069
187	0,0166	235	0,2400	283	0,8122	331	0,000396	379	0,000066
188	0,0173	236	0,2510	284	0,7908	332	0,000383	380	0,000064
189	0,0181	237	0,2624	285	0,7700	333	0,000370	381	0,000062
190	0,0190	238	0,2744	286	0,7420	334	0,000355	382	0,000059
191	0,0199	239	0,2869	287	0,7151	335	0,000340	383	0,000057
192	0,0208	240	0,3000	288	0,6891	336	0,000327	384	0,000055
193	0,0218	241	0,3111	289	0,6641	337	0,000315	385	0,000053
194	0,0228	242	0,3227	290	0,6400	338	0,000303	386	0,000051
195	0,0239	243	0,3347	291	0,6186	339	0,000291	387	0,000049
196	0,0250	244	0,3471	292	0,5980	340	0,000280	388	0,000047
197	0,0262	245	0,3600	293	0,5780	341	0,000271	389	0,000046
198	0,0274	246	0,3730	294	0,5587	342	0,000263	390	0,000044
199	0,0287	247	0,3865	295	0,5400	343	0,000255	391	0,000042
200	0,0300	248	0,4005	296	0,4984	344	0,000248	392	0,000041
201	0,0334	249	0,4150	297	0,4600	345	0,000240	393	0,000039
202	0,0371	250	0,4300	298	0,3989	346	0,000231	394	0,000037
203	0,0412	251	0,4465	299	0,3459	347	0,000223	395	0,000036
204	0,0459	252	0,4637	300	0,3000	348	0,000215	396	0,000035
205	0,0510	253	0,4815	301	0,2210	349	0,000207	397	0,000033
206	0,0551	254	0,5000	302	0,1629	350	0,000200	398	0,000032
207	0,0595	255	0,5200	303	0,1200	351	0,000191	399	0,000031
208	0,0643	256	0,5437	304	0,0849	352	0,000183	400	0,000030
209	0,0694	257	0,5685	305	0,0600	353	0,000175		
210	0,0750	258	0,5945	306	0,0454	354	0,000167		
211	0,0786	259	0,6216	307	0,0344	355	0,000160		
212	0,0824	260	0,6500	308	0,0260	356	0,000153		
213	0,0864	261	0,6792	309	0,0197	357	0,000147		
214	0,0906	262	0,7098	310	0,0150	358	0,000141		
215	0,0950	263	0,7417	311	0,0111	359	0,000136		
216	0,0995	264	0,7751	312	0,0081	360	0,000130		
217	0,1043	265	0,8100	313	0,0060	361	0,000126		
218	0,1093	266	0,8449	314	0,0042	362	0,000122		
219	0,1145	267	0,8812	315	0,0030	363	0,000118		
220	0,1200	268	0,9192	316	0,0024	364	0,000114		
221	0,1257	269	0,9587	317	0,0020	365	0,000110		
222	0,1316	270	1,0000	318	0,0016	366	0,000106		
223	0,1378	271	0,9919	319	0,0012	367	0,000103		
224	0,1444	272	0,9838	320	0,0010	368	0,000099		
225	0,1500	273	0,9758	321	0,000819	369	0,000096		
226	0,1583	274	0,9679	322	0,000670	370	0,000093		
227	0,1658	275	0,9600	323	0,000540	371	0,000090		

Taulukko 1.3

B (λ), R (λ) [dimensioton], 380 nm–1 400 nm

λ (nm)	B (λ)	R (λ)
$300 \leq \lambda < 380$	0,01	—
380	0,01	0,1
385	0,013	0,13
390	0,025	0,25
395	0,05	0,5
400	0,1	1
405	0,2	2
410	0,4	4
415	0,8	8
420	0,9	9
425	0,95	9,5
430	0,98	9,8
435	1	10
440	1	10
445	0,97	9,7
450	0,94	9,4
455	0,9	9
460	0,8	8
465	0,7	7
470	0,62	6,2
475	0,55	5,5
480	0,45	4,5
485	0,32	3,2
490	0,22	2,2
495	0,16	1,6
500	0,1	1
$500 < \lambda \leq 600$	$10^{0,02 \cdot (450 - \lambda)}$	1
$600 < \lambda \leq 700$	0,001	1
$700 < \lambda \leq 1\,050$	—	$10^{0,002 \cdot (700 - \lambda)}$
$1\,050 < \lambda \leq 1\,150$	—	0,2
$1\,150 < \lambda \leq 1\,200$	—	$0,2 \cdot 10^{0,02 \cdot (1\,150 - \lambda)}$
$1\,200 < \lambda \leq 1\,400$	—	0,02

LIITE II

Optinen lasersäteily

Biofysikaalisesti merkittävät optisen säteilyn altistumisarvot voidaan määrittää alla esitettyjen kaavojen avulla. Tietyn kaavan käyttö riippuu kulloisestakin lähteestä tulevan säteilyn aallonpituudesta ja kestosta, ja tuloksia olisi verrattava vastaaviin altistumisen raja-arvoihin, jotka on esitetty taulukoissa 2.2–2.4. Joihinkin optisen lasersäteilyn lähteisiin voidaan soveltaa useampaa kuin yhtä altistumisarvoa ja sitä vastaavaa altistumisrajaa.

Taulukoissa 2.2–2.4 laskentaparametreinä käytettävät kertoimet on lueteltu taulukossa 2.5 ja toistuvan altistumisen osalta käytettävät korjauskertoimet taulukossa 2.6.

$$E = \frac{dP}{dA} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$$

$$H = \int_0^t E(t) \cdot dt \text{ [J m}^{-2}\text{]}$$

Selitykset:

dP *teho*, joka ilmaistaan watteina [W];

dA *pinta-ala*, joka ilmaistaan neliömetreinä [m²];

E (t), E *irradianssi tai tehotiheys*: tietylle pinnalle kohdistuva säteilyteho pinta-alayksikköä kohti, joka ilmaistaan yleensä watteina neliometriä kohti [W m⁻²]; E (t):n ja E:n arvot tulevat mittauksista tai laitteiston valmistaja voi toimittaa ne;

H *energiatiheys*: irradianssin aikaintegraali, ilmaistaan jouleina neliometriä kohti [J m⁻²];

t *aika, altistumisen kesto*, joka ilmaistaan sekunteina [s];

λ *aallonpituus*, joka ilmaistaan nanometreinä [nm];

γ *mittausnäkökentän rajaava kartiokulma*, joka ilmaistaan milliradiaaneina [mrad];

γ_m *mittausnäkökenttä*, joka ilmaistaan milliradiaaneina [mrad];

α *lähteen kulmakoko*, joka ilmaistaan milliradiaaneina [mrad];

rajaava aukko: ympyränmuotoinen alue, jolta irradianssin ja energiatiheyden keskiarvot lasketaan;

G *integroitu radianssi*: radianssin integraali tietyssä altistumisaikana, joka ilmaistaan säteilyenergiana säteilevän pinnan pinta-alayksikköä kohti ja säteilyn avaruuskulmayksikköä kohti, jouleina neliometriä ja steradiania kohti [J m⁻² sr⁻¹].

Taulukko 2.1

Säteilyvauriot

Aallonpituus [nm] λ	Säteilyalue	Kohteena oleva elin	Vaurio	Altistumisen raja-arvoa koskeva taulukko
180–400	UV	silmä	fotokemiallinen vaurio ja lämpöaurio	2.2, 2.3
180–400	UV	iho	eryteema	2.4
400–700	näkyvä	silmä	verkkokalvon vaurio	2.2
400–600	näkyvä	silmä	valokemiallinen vaurio	2.3
400–700	näkyvä	iho	lämpöaurio	2.4
700–1 400	IRA	silmä	lämpöaurio	2.2, 2.3
700–1 400	IRA	iho	lämpöaurio	2.4
1 400–2 600	IRB	silmä	lämpöaurio	2.2
2 600–10 ⁶	IRC	silmä	lämpöaurio	2.2
1 400–10 ⁶	IRB, IRC	silmä	lämpöaurio	2.3
1 400 –10 ⁶	IRB, IRC	iho	lämpöaurio	2.4

Taulukko 2.2

Silmään kohdistuvan laseraltistumisen raja-arvot — Lyhykestoinen altistuminen < 10 s

Aallonpituus ^a [nm]		Aukko	10 ¹³ - 10 ⁻¹¹	10 ⁻¹¹ - 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ - 10 ⁻⁷	Kesto [s]	10 ⁻⁷ - 1,8 · 10 ⁻⁵	1,8 · 10 ⁻⁵ - 5 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻⁵ - 10 ⁻³	10 ⁻³ - 10 ¹
UVC	180–280	1 mm, kun t<0,3 s; 1,5 · 10 ^{-13,5} W m ⁻² , kun 0,3<t<10 s	10 ¹³ - 10 ⁻¹¹	10 ⁻¹¹ - 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ - 10 ⁻⁷	Kesto [s]	10 ⁻⁷ - 1,8 · 10 ⁻⁵	1,8 · 10 ⁻⁵ - 5 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻⁵ - 10 ⁻³	10 ⁻³ - 10 ¹
	280–302									
	303									
	304									
	305									
	306									
	307									
	308									
	309									
	310									
UVB	311	E = 3 · 10 ⁻¹⁰ · [W m ⁻²] Ks. huom. ^c	10 ¹³ - 10 ⁻¹¹	10 ⁻¹¹ - 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ - 10 ⁻⁷	Kesto [s]	10 ⁻⁷ - 1,8 · 10 ⁻⁵	1,8 · 10 ⁻⁵ - 5 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻⁵ - 10 ⁻³	10 ⁻³ - 10 ¹
	312									
	313									
	314									
UVA	315–400	1 mm, kun t<0,3 s; 1,5 · 10 ^{-13,5} W m ⁻² , kun 0,3<t<10 s	10 ¹³ - 10 ⁻¹¹	10 ⁻¹¹ - 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ - 10 ⁻⁷	Kesto [s]	10 ⁻⁷ - 1,8 · 10 ⁻⁵	1,8 · 10 ⁻⁵ - 5 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻⁵ - 10 ⁻³	10 ⁻³ - 10 ¹
	400–700									
	700–1 050									
	1 050–1 400									
Näkyvä & IRA	1 400–1 500	7 mm	10 ¹³ - 10 ⁻¹¹	10 ⁻¹¹ - 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ - 10 ⁻⁷	Kesto [s]	10 ⁻⁷ - 1,8 · 10 ⁻⁵	1,8 · 10 ⁻⁵ - 5 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻⁵ - 10 ⁻³	10 ⁻³ - 10 ¹
	1 500–1 800									
	1 800–2 600									
	2 600–10 ⁶									
IRB &	1 400–1 500	Ks. huom. ^b	10 ¹³ - 10 ⁻¹¹	10 ⁻¹¹ - 10 ⁻⁹	10 ⁻⁹ - 10 ⁻⁷	Kesto [s]	10 ⁻⁷ - 1,8 · 10 ⁻⁵	1,8 · 10 ⁻⁵ - 5 · 10 ⁻⁵	5 · 10 ⁻⁵ - 10 ⁻³	10 ⁻³ - 10 ¹
	1 500–1 800									
	1 800–2 600									
	2 600–10 ⁶									

a Jos laserin aallonpituudella on kaksi rajaa, sovelletaan niistä tiukempaa.
b Kun $1\ 400 \leq \lambda < 10^6$ nm: aukon läpimitta = 1 mm, kun $t \leq 0,3$ s; ja $1,5 \cdot t^{0,75}$ mm, kun $0,3 < t < 10$ s; kun $10^5 \leq \lambda < 10^6$ nm: aukon läpimitta = 11 mm.
c Koska näillä pulsseilla tiedot ovat puutteelliset, ICNIRP suosittelee 1 ns:n irradianssin rajan käyttöä.
d Taulukossa on yksittäisten laserpulsseiden arvot. Silloin kun on kyse monista laserpulsseista, välille T_{min} (lueteltu taulukossa 2.6) sijoituvien laserpulsseiden kestot on laskettava yhteen ja tulokseksi saatua arvoa on käytettävä tms kaavassa: $5,6 \cdot 10^3 \cdot t^{0,25}$.

Taulukko 2.3
Silmään kohdistuvan laseraltistumisen raja-arvot — Pitkäkestoinen altistuminen ≥ 10 s

Aallonpituus λ [nm]		Autko	Kesto [s]	
UVC	180–280	3,5 mm	10 ¹ - 10 ²	10 ² - 10 ⁴
	280–302		H = 30 [J m ⁻²]	
	303		H = 40 [J m ⁻²]	
	304		H = 60 [J m ⁻²]	
	305		H = 100 [J m ⁻²]	
	306		H = 160 [J m ⁻²]	
	307		H = 250 [J m ⁻²]	
	308		H = 400 [J m ⁻²]	
	309		H = 630 [J m ⁻²]	
	310		H = 1,0 · 10 ³ [J m ⁻²]	
UVB	311	H = 1,6 · 10 ³ [J m ⁻²]		
	312	H = 2,5 · 10 ³ [J m ⁻²]		
	313	H = 4,0 · 10 ³ [J m ⁻²]		
	314	H = 6,3 · 10 ³ [J m ⁻²]		
	315–400	H = 10 ⁴ [J m ⁻²]		
Näkyvä 400 – 700	400–600 Fotokemiallinen ^b Verkkokalvon vaurio	7 mm	H = 100 C _β [J m ⁻²] (γ = 11 mrad) ^d	E = 1 C _β [W m ⁻²]; (γ = 1,1 t ^{0,5} mrad) ^d E = 1 C _β [W · m ⁻²] (γ = 110 mrad) ^d
	400–700 Terminen ^b Verkkokalvon vaurio		jos α < 1,5 mrad, niin E = 10 [W m ⁻²] jos α > 1,5 mrad ja t ≤ T ₂ , niin H = 18 C _β t ^{0,75} [J m ⁻²] jos α > 1,5 mrad ja t > T ₂ , niin E = 18 C _β T ₂ ^{-0,25} [W m ⁻²] jos α < 1,5 mrad, niin E = 10 C _α C _γ [W m ⁻²] jos α > 1,5 mrad ja t ≤ T ₂ , niin H = 18 C _α C _γ t ^{0,75} [J m ⁻²] jos α > 1,5 mrad ja t > T ₂ , niin E = 18 C _α C _γ T ₂ ^{-0,25} [W m ⁻²] (ei saa ylittää 1 000 W m ⁻²)	
IRA	700–1 400	7 mm		
IRB & IRC	1 400–10 ⁶	ks. ^c	E = 1 000 [W m ⁻²]	

^a Jos laserin aallonpituudella tai muulla ominaisuudella on kaksi rajaa, sovelletaan niistä tiukempaa.
^b Pienten lähteiden osalta, joiden kulmakoko on 1,5 mrad tai pienempi, näkyvän säteilyn kaksinkertainiset raja-arvot E alueella 400 nm–600 nm pelkistyvät termisen vaurion rajaksi, kun 10 s ≤ t < T₁, ja fotokemiallisen vaurion rajaksi altistumisaajan ollessa pienempi T₁ ja T₂ ks. taulukko 2.5. Fotokemiallisen säteilyn verkkokalvovaurion raja-arvo voidaan ilmaista myös ajan suhteen integroituna radiaansina G = 10³ C_β [J m⁻² · sr⁻¹], kun 10 s < t ≤ 10 000 s, ja radiaansina L = 100 C_β [W · m⁻² · sr⁻¹], kun t > 10 000 s. G:n ja L:n mittaamisessa keskilarvon määrittävänä näkökenttänä on käytettävä γ₅₀-ää. CIE:n määrittämä virallinen raja näkyvän säteilyn ja infrapunasäteilyn välillä on 780 nm. Aallonpituuskaislojen nimet sisältävä sarakke on tarkoitettu ainoastaan antamaan käyttäjälle parempi kuva asiasta. (CEN käyttää merkintää G, CIE merkintää L, ja IEC ja CENELEC käyttävät merkinäitä L_p).
^c Aallonpituus 1 400–10⁶ nm: aukon halkaisija = 3,5 mm; aallonpituus 10³–10⁶ nm: aukon halkaisija = 11 mm.
^d Altistumisarvon mittausta varten y määritetään seuraavasti: jos α (lähteen kulmakoko) > γ (rajaava kartiokulma, vastaavassa sarakkeessa), niin mittauskokentian (γ₅₀) tulee olla annettu y:n arvo. (Jos käytetään laajempaa mittauskokentiaa, vaara yllärytävään.) Jos α < γ, niin mittauskokentian (γ₅₀) on oltava riittävän laaja kattamaan lähteen kokonaan, mutta sitä ei muuteta rajaksi ja se voi olla laajempi kuin γ.

Taulukko 2.4

Ihoon kohdistuvan laseraltistumisen raja-arvot

Aallonpituus ^a [nm]		Aukko	Kesto [s]						
			$< 10^{-9}$	$10^{-9} - 10^{-7}$	$10^{-7} - 10^{-5}$	$10^{-3} - 10^1$	$10^1 - 10^3$	$10^3 \cdot 3 \cdot 10^4$	
UV (A, B, C)	180–400	3,5 mm	$E = 3 \cdot 10^{10} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$	Samat kuin silmän alitumisraajat					
Näkyvä & IRA	400–700	3,5 mm	$E = 2 \cdot 10^{11} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$	$H = 200 C_A \text{ [J m}^{-2}\text{]}$	$H = 1,1 \cdot 10^{-4} C_A \text{ t}^{0,25} \text{ [J m}^{-2}\text{]}$	$E = 2 \cdot 10^3 C_A \text{ [W m}^{-2}\text{]}$			
	700–1 400		$E = 2 \cdot 10^{11} C_A \text{ [W m}^{-2}\text{]}$						
IRB & IRC	1 400–1 500		$E = 10^{12} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$						
	1 500–1 800		$E = 10^{13} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$						
	1 800–2 600		$E = 10^{12} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$						
	2 600–10 ⁶	$E = 10^{11} \text{ [W m}^{-2}\text{]}$							

a Jos laserin aallonpituudella tai muulla ominaisuudella on kaksi rajaa, sovelletaan niistä tiukempaa.

Taulukko 2.5

Sovellettavat korjauskertoimet ja muut laskentaparametrit

ICNIRP:n esittämä parametri	Aallonpituusalue (nm)	Arvo
C_A	$\lambda < 700$	$C_A = 1,0$
	$700 — 1\,050$	$C_A = 10^{0,002(\lambda - 700)}$
	$1\,050 — 1\,400$	$C_A = 5,0$
C_B	$400 — 450$	$C_B = 1,0$
	$450 — 700$	$C_B = 10^{0,02(\lambda - 450)}$
C_C	$700 — 1\,150$	$C_C = 1,0$
	$1\,150 — 1\,200$	$C_C = 10^{0,018(\lambda - 1\,150)}$
	$1\,200 — 1\,400$	$C_C = 8,0$
T_1	$\lambda < 450$	$T_1 = 10\text{ s}$
	$450 — 500$	$T_1 = 10 \cdot [10^{0,02(\lambda - 450)}]\text{ s}$
	$\lambda > 500$	$T_1 = 100\text{ s}$
ICNIRP:n esittämä parametri	Biologinen vaikutus	Arvo
$\alpha_{\min}$	Kaikki lämpövaikutukset	$\alpha_{\min} = 1,5\text{ mrad}$
ICNIRP:n esittämä parametri	Kulmakoko (mrad)	Arvo
C_E	$\alpha < \alpha_{\min}$	$C_E = 1,0$
	$\alpha_{\min} < \alpha < 100$	$C_E = \alpha/\alpha_{\min}$
	$\alpha > 100$	$C_E = \alpha^2/(\alpha_{\min} \cdot \alpha_{\max})\text{ mrad missä } \alpha_{\max} = 100\text{ mrad}$
T_2	$\alpha < 1,5$	$T_2 = 10\text{ s}$
	$1,5 < \alpha < 100$	$T_2 = 10 \cdot [10^{(\alpha - 1,5) / 98,5}]\text{ s}$
	$\alpha > 100$	$T_2 = 100\text{ s}$

ICNIRP:n esittämä parametri	Altistumisaika (s)	Arvo
γ	$t \leq 100$	$\gamma = 11$ [mrad]
	$100 < t < 10^4$	$\gamma = 1,1 t^{0,5}$ [mrad]
	$t > 10^4$	$\gamma = 110$ [mrad]

Taulukko 2.6

Korjauskertoimet toistuvaa altistumista varten

Kaikkia kolmea alla olevaa yleissääntöä tulee soveltaa peräkkäisiä pulsseja lähettävien tai skannaavien laserjärjestelmien aiheuttamaan toistuvaan altistumiseen:

1. Pulssijonon yksittäisestä pulssista aiheutuva altistuminen ei saa ylittää kyseisen pulssinpituisen yksittäisen pulssin altistumisen raja-arvoa.
2. Minkään ajan t kestoisen pulssijoukon (tai pulssijonon osan) aiheuttama altistuminen ei saa ylittää aikaa t vastaavaa altistumisen raja-arvoa.
3. Minkään pulssijoukon yksittäisen pulssin aiheuttama altistuminen ei saa ylittää yksittäisen pulssin altistumisen raja-arvoa kerrottuna kumulatiivisella lämpökorjauskertoimella $C_p = N^{-0,25}$, jossa N on pulssien lukumäärä. Tätä sääntöä sovelletaan ainoastaan lämpövaurioilta suojaaviin altistumisrajoihin, jolloin kaikkia alle $T_{\min}$ aikana tulevia pulsseja pidetään yksittäisenä pulssina.

Parametri	Spektrilue (nm)	Arvo
$T_{\min}$	$315 < \lambda \leq 400$	$T_{\min} = 10^{-9}$ s (= 1 ns)
	$400 < \lambda \leq 1\,050$	$T_{\min} = 18 \cdot 10^{-6}$ s (= 18 μ s)
	$1\,050 < \lambda \leq 1\,400$	$T_{\min} = 50 \cdot 10^{-6}$ s (= 50 μ s)
	$1\,400 < \lambda \leq 1\,500$	$T_{\min} = 10^{-3}$ s (= 1 ms)
	$1\,500 < \lambda \leq 1\,800$	$T_{\min} = 10$ s
	$1\,800 < \lambda \leq 2\,600$	$T_{\min} = 10^{-3}$ s (= 1 ms)
	$2\,600 < \lambda \leq 10^6$	$T_{\min} = 10^{-7}$ s (= 100 ns)

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 145—146, 2 ½ arkkia